

前 言

本标准等同采用 IEC 512-1:1994《电子设备用机电元件 基本试验规程及测量方法 第1部分:总则》和其修改单(1995),是对 GB 5095.1—85 进行的第一次修订。

附录 B 给出了未来 IEC 512 标准的试验方法项目与现行标准的试验方法项目的对照表,即《IEC 512 试验方法新旧编号对照表(1995年8月)》。

本标准的附录 A 和附录 B 是提示的附录。

本标准由中华人民共和国电子工业部提出。

本标准由全国电子设备用机电元件标准化技术委员会归口。

本标准由电子工业部标准化研究所负责起草。

本标准主要起草人:余玉芳、汪其龙、张菊华、王玉堂。

IEC 前言

1) IEC(国际电工委员会)是由各国家电工委员会(IEC 国家委员会)组成的世界性标准化组织。IEC 的目的是促进电工电子领域标准化问题的国际合作。为此目的,除其他活动外,IEC 发布国际标准。国际标准的制定由技术委员会承担,对所涉及内容关切的任何 IEC 国家委员会均可参加国际标准的制定工作。与 IEC 有联系的任何国际,政府和非官方组织也可以参加国际标准的制定。IEC 与国际标准化组织(ISO)根据两组织间协商确定的条件保持密切的合作关系。

2) IEC 在技术问题上的正式决议或协议,是由对这些问题特别关切的国家委员会参加的技术委员会制定的,对所涉及的问题尽可能地代表了国际上的一致意见。

3) 这些决议或协议以标准,技术报告或导则的形式发布,以推荐的形式供国际上使用,并在此意义上,为各国家委员会认可。

4) 为了促进国际上的统一,各 IEC 国家委员会有责任使其国家和地区标准尽可能采用 IEC 标准。IEC 标准与相应国家或地区标准之间的任何差异应在国家或地区标准中指明。

国际标准 IEC 512-1 由 IEC/TC48(电子设备用机电元件和机械结构)制定的。

本标准第三版取代了 1984 年出版的第二版及其修定 1(1988 年)。

本标准文本以下列文件为依据:

DIS	表决报告
48(C. O.)341	48(C. O.)344

表决批准本标准的详细资料可在上表列出的表决报告中查阅。

附录 A 仅供参考。

引 言

本标准的主要内容是关于试验方法和试验程序的基本规定,以提供给制定某一元件的总规范、分规范或详细规范时采用,以便达到试验程序的一致性和再现性。

“环境条件试验”或“环境试验”一词,是指产品可能经受的自然及模拟环境条件(包括电应力),以便对元件在实际使用、运输及贮存条件下的性能作出评价。

本标准并不规定元件性能指标的要求,受试产品允许的性能指标范围在有关规范中规定。

附录 A 列出已发布的试验项目,将随时作适当的修订。

为了进一步扩充每一篇规定的试验项目,并保持表示方法的一致性,每一篇试验项目应分成小类。第一小类加一个小写字母来表示,例如在 GB/T 5095. 2—1997(idt IEC 512-2)中:

第二篇 电连续性和接触电阻测试

试验 2a:接触电阻——毫伏法

试验 2b:接触电阻——规定试验电流法